 search	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/622,433	CHOE ET AL.	
Examiner	Art Unit	
LUU MATTHEW	3663	

SEARCHED			
			<u> </u>
Class	Subclass	Date	Examiner
J45	>		
345	882	9/18/06	M.L.
	092		
	BII		
	613		
	660		
	667		
	668		
	669		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
see the	altached	1 US-PG.PU	3
ે	balon	9/26/06	M.L
		•	

	DATE	EXMR
t rast searched	apploc	M.L
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		